

cpu疲劳测试，口罩加速老化试验

产品名称	cpu疲劳测试，口罩加速老化试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

cpu疲劳测试，口罩加速老化试验

电子设备耐久性试验

电子设备耐久性试验的复杂程度随着受试系统的复杂程度增加而成比例地提高。然而，不管复杂性如何，确定耐久性设计准则和试验剖面的步骤是相同的。基本步骤如下：a.确定系统或组件在整个寿命期内可能遇到的应力，包括环境应力和负载。确定环境应力时要考虑到制造、运输、存储、后勤支持、执行任务和维护过程中遇到的环境条件；确定负载时则要考虑设备通/断循环，各种工作模式和维修活动的次数。b.确定产品的材料对寿命期内所遇到的各种应力的敏感度及其潜在故障模式。对于耐久性试验来说，不必考虑那些不会引起材料老化的应力。例如，一个电子设备的黑盒子在6%寿命期中要经受20°C到30°C的热循环，假如这个电子设备所用的材料在此温度范围内热膨胀系数很小，20°C-30°C范围的热循环使材料产生疲劳的可能性很小，以致可以忽略不计，且不会引起材料老化，则耐久性试验中就没有必要考虑模拟这种热循环。c.根据上述a和b两条中收集到的信息确定耐久性试验的试验剖面。d.使用加速应力缩短试验时间。如果不用加速应力，完成整个试验剖面可能要几年时间。因而要用加速应力将试验时间压缩到可以接受的程度，此时要遵循以下4个基本准则：（1）加速应力下的故障模式必须与外场应力下的相同，即加速应力条件要保持真实性；（2）施加的加速应力应在材料的弹性极限之内；（3）在额定应力或更高应力的作用下，其故障概率密度函数曲线形状应当是一致的；（4）批生产设备的寿命特性应是可再现的，不可再现率要低于5%。

一旦制订出了试验剖面，不管是否加速，进行试验后都应给出设备的寿命基数。要注意的是试验的精度与受试系统的复杂程度成反比，此外，用较低量值做耐久性试验时，得到的寿命估计值更为真实。